

## 儀器介紹



### 一、儀器名稱

中文名稱：非破壞性檢測儀器一組

英文名稱：Bruker Tracer III SD

英文簡稱：XRF

### 二、儀器廠牌、型號、購置年限

廠牌：Bruker Elemental、TSI

購置年限：2016年

### 三、重要規格

1. XRF 手持式 X 射線螢光光譜分析儀(Bruker Tracer III SD)
2. 傅立葉轉換紅外光譜儀(BRUKER FT-IR ALPHA)
3. 非破壞檢測儀器-精密穩頻拉曼雷射分析儀(ProTT-EZRaman-A6-785nm、ProTT-EZRaman-G5-532nm)

### 四、服務項目

X 射線螢光檢測、紅外光源檢測、拉曼光源檢測

### 五、收費標準

計費項目	計費單位	計費數量	計費單價
X 射線螢光檢測	件	1	2,000 元
紅外光源檢測	件	1	2,000 元
拉曼光源檢測	件	1	2,000 元

## 六、開放時間表

週一至週五：0900-1200，1400-1700

## 七、聯絡方式

儀器專家：張元鳳教授，02-77343037 (changyfntnu@gmail.tw)

儀器操作技術員：潘怡伶小姐，02-77343481，(phy610@gmail.tw)

## 八、儀器送測須知

儀器操作由本中心受過教育訓練合格之專業修復師執行，囿於中心事務繁忙，無法排定固定時段開放使用，故如有需借用儀器，請於一週前以電話預約方式排定檢測時間。